

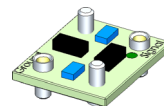


DIREKT ZUM PRODUKT

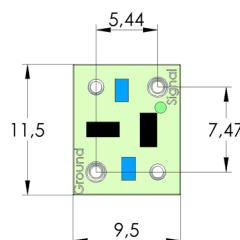
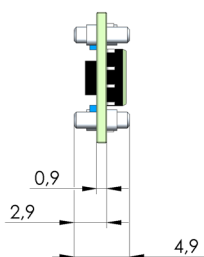
- Komponente für den Opens-Test, zur kapazitiven Prüfung von Halbleiterchips auf Durchbrüche, Kurzschlüsse und Lötfehler
- Geeignet für Teradyne Testsysteme

Verwendung

Die FrameScan FX 2.0 Elektronikplatte wird zur kapazitiven Prüfung integrierter Schaltkreise verwendet, um die drahtgebundenen Anschlüsse im Inneren eines integrierten Schaltkreises auf Durchbrüche, Kurzschlüsse und Lötfehler zu prüfen.



1:1



Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Opens Tests
Baureihe:	OTC
Typ:	Teradyne OpensTest
Ausführung:	FrameScan FX 2.0
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Auslieferungszustand:	Elektronikplatte
Breite:	9,5 mm
Höhe:	4,9 mm
Gewicht:	0,01 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Vakuum-Prüfadapter (VA):
Wechselsätze WS:

VA 20xx
WS Teradyne/TSH5x

Technische Daten

Länge: 11,5 mm
Außenmaße (BxTxH): 9,5 x 11,5 x 4,9 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

